

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
18 août 2005 (18.08.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/075956 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷ : G01N 3/56,
33/30

CEDEX 16 (FR). ECOLE CENTRALE DE LYON
[FR/FR]; 36 avenue Guy de Collongue, F-69134 ECULLY
CEDEX (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2005/050063

(72) Inventeurs; et

(22) Date de dépôt international : 2 février 2005 (02.02.2005)

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) :
MAZUYER, Denis [FR/FR]; 5 rue des Gantries, F-69130
ECULLY (FR). LARGE, André [FR/FR]; 10 rue du Bon
Pasteur, F-69001 LYON (FR).

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(74) Mandataires : TANTY, François etc.; NONY & ASSO-
CIES, 3 rue de Penthievre, F-75008 PARIS (FR).

(30) Données relatives à la priorité :
0401017 3 février 2004 (03.02.2004) FR

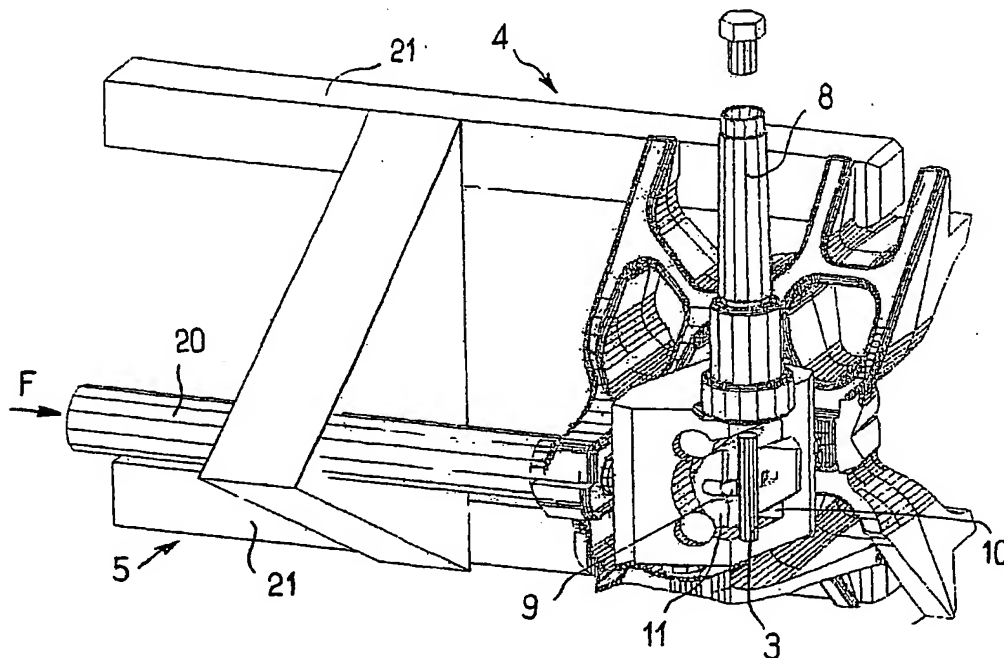
(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,

(71) Déposants (pour tous les États désignés sauf US) :
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE [FR/FR]; 3 rue Michel Ange, F-75794 PARIS

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: TRIBOMETER

(54) Titre : TRIBOMETRE



(57) Abstract: The invention relates to a tribometer comprising: a first support assembly which is designed to receive a central rotating cylindrical test piece (3) and to rotate same around the axis thereof; and a second support assembly (4) which is designed to receive a plurality of peripheral test pieces, preferably three, and to enable simultaneous contact between the central test piece (3) and the peripheral test pieces (9) in an isostatic configuration, such that the central test piece can rub against the peripheral test pieces while being rotated.

[Suite sur la page suivante]

WO 2005/075956 A1



MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

— avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale

(57) Abrégé : La présente invention concerne un tribomètre comportant un premier ensemble de support agencé pour recevoir une éprouvette centrale (3), laquelle est cylindrique de révolution, et l'entraîner en rotation suivant son axe, - un second ensemble de support (4) agencé pour recevoir une pluralité d'éprouvettes périphériques, de préférence trois, et permettre le contact de ladite éprouvette centrale (3) simultanément avec lesdites éprouvettes périphériques (9), dans une configuration isostatique, de sorte que l'éprouvette centrale (3) se déforme sous l'effet de la pression exercée par lesdites éprouvettes périphériques (9).